## (12)特許公報(B2)

### (11)特許番号 **特許第7015681号**

(P7015681)

(45)発行日	令和4年2月3日(2022.2.3)	
---------	--------------------	--

(51)国際特許分	類		FΙ		
H 0 5 B	3/00	(2006.01)	H 0 5 B	3/00	3 1 0 C
G 0 5 D	23/19	(2006.01)	G 0 5 D	23/19	J

(21)出願番号	特願2017-230501(P2017-230501)	(73)特許権者	000105350
(22)出願日	平成29年11月30日(2017.11.30)		KOA株式会社
(65)公開番号	特開2019-101645(P2019-101645		長野県伊那市荒井3672番地
	A)	(74)代理人	100121083
(43)公開日	令和1年6月24日(2019.6.24)		弁理士 青木 宏義
審査請求日	令和2年10月15日(2020.10.15)	(74)代理人	100138391
			弁理士 天田 昌行
		(74)代理人	100121049
			弁理士 三輪 正義
		(72)発明者	植田 敏嗣
			福岡県北九州市八幡西区折尾 三丁目3
			番41
		(72)発明者	大井川 寛
			長野県伊那市荒井3672番地 KOA
			株式会社内
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ヒータ温度制御回路、及び、それを用いたセンサ装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

- ヒータの温度を制御するヒータ温度制御回路であって、
- 前記ヒータ温度制御回路は、第1回路と第2回路とが並列に接続されたブリッジ回路と、
- 前記ブリッジ回路に接続されるオペアンプと、を含み、
- 前記第1回路は、前記ヒータと抵抗器とが直列に接続され、前記第1回路の中点が、前記 オペアンプの一方の入力部に接続されており、
- 前記第2回路からは、前記ブリッジ回路のリファレンス電圧Vrefに、前記ヒータの目 標抵抗値Rhと前記抵抗器の抵抗値R1との分圧比を乗じた出力値Voutが、前記オペ アンプの他方の入力部に入力され<u>、</u>
- <u>前記第2回路は、D/Aコンバータ、或いは、マルチプレクサを含み、前記D/Aコンバ</u> ータ、或いは、マルチプレクサの出力部が、前記オペアンプの他方の入力部に接続されて いることを特徴とするヒータ温度制御回路。

【請求項2】

前記第2回路は、前記D/Aコンバータを含み、前記D/Aコンバータには、前記分圧比 に2n-1(nは、前記D/Aコンバータのビット数)を乗じたデジタルデータが入力さ れることを特徴とする請求項<u>1</u>に記載のヒータ温度制御回路。

【請求項3】

前記オペアンプの出力部側に、ローパスフィルタが接続されていることを特徴とする請求 項1<u>又は</u>請求項<u>2</u>に記載のヒータ温度制御回路。

(19)日本国特許庁(JP)

### 請求項の数 6 (全15頁)

(24)登録日 令和4年1月26日(2022.1.26)

【請求項4】 前記ブリッジ回路の入力部と、前記ローパスフィルタの出力部との間に、電流増幅用トラ ンジスタが接続されていることを特徴とする請求項3に記載のヒータ温度制御回路。 【請求項5】 センサ素子と、前記センサ素子に熱を加える前記ヒータ、及び請求項1から請求項4のい ずれかに記載のヒータ温度制御回路と、を有することを特徴とするセンサ装置。 【請求項6】 前記センサ素子は、ガス濃度を検出することを特徴とする請求項<u>5</u>に記載のセンサ装置。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 [0001]この発明は、ヒータ温度制御回路、及び、それを用いたセンサ装置に関する。 【背景技術】 [0002]特許文献1及び特許文献2には、マイクロヒータの温度制御装置に関する発明が開示され ている。 [0003]特許文献1の図1や、特許文献2の図2に示すように、温度制御装置は、ホイートストン ブリッジと、ホイートストンブリッジに接続される駆動用のオペアンプと、を有したフィ ードバック制御方式が広く知られている。 [0004]特許文献1及び特許文献2では、マイクロヒータを酸素濃度装置やアルコール濃度検知装 置に使用している。 [0005]ところで、ガス濃度の検出精度を高めるためには、ヒータ温度を一定に維持できる高精度 の制御回路が必要である。 【先行技術文献】 【特許文献】 [0006]【文献】特開2011-185742号公報 特開2012-251975号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 [0007]しかしながら、従来の温度制御装置では、ヒータ温度制御回路に使用する抵抗器の精度に 依存した温度誤差が生じる。このため、ヒータ温度を一定値に高精度に維持することがで きない。従来の問題点を、図面を用いて説明する。図6は、従来におけるヒータ温度制御 回路の最小単位である。 [0008]図6に示すように、ホイートストンブリッジは、ヒータ100と、抵抗器101、102 103と、を有して形成される。図6に示すように、抵抗器101とヒータ100とが 直列に接続され、その中点(出力部)104が、オペアンプ105の半転入力端子(Vi n - 端子)105aに接続されている。また、抵抗器102と抵抗器103とが直列に接 続され、その中点(出力部)106が、オペアンプ105の非反転入力端子(Vin+端 子)105bに接続されている。 [0009]図6に示すブリッジ回路の平衡条件は、以下の式(1)で示される。 [0010]【数1】

(2)

20

10

30

$$R_{h} = \frac{R_{1}}{R_{2}}R_{3} \ (1)$$

ここで、 R<sub>h</sub>は、安定時のヒータ温度(目標温度)における抵抗値である。 【0011】 図6のヒータ温度制御回路では、各抵抗器101、102、103の抵抗値 R<sub>1</sub>、 R<sub>2</sub>、 R<sub>3</sub>を決定することで、自動的に負帰還が掛かり、ヒータ100が目標温度で安定するよ うに回路が動作する。 【0012】

ところで、各抵抗器101、102、103の抵抗値R1、R2、R3は、夫々固有の抵抗値許容誤差と抵抗温度係数(TCR)を有している。 【0013】

このため、抵抗値許容誤差及び抵抗温度係数(TCR)を加味すると、式(1)は、以下の式(2)で示される。

**[**0014]

【数 2 】

$$R_{h} = \frac{(1 + E_{1} + E_{T1})R_{1}}{(1 + E_{2} + E_{T2})R_{2}} \times (1 + E_{3} + E_{T3})R_{3} \quad (2)$$
<sup>20</sup>

E:抵抗値許容誤差  $E_r:$ 抵抗温度係数(TCR)による誤差  $E_r = TCR \times \Delta T_r$  (外気温変化)

~

【0015】 このため、ブリッジ平衡条件により定まる R h に、誤差が生じることは避けられない。 【0016】 この誤差は、結果的に、目標温度に対するヒータ温度の安定点の偏差として現れる。 【0017】 ここで、目標抵抗値 R h は、以下の式(3)で定義される。 【数3】

$$R_h = R_0 \left( 1 + TCR(T_h - T_0) \right) \quad (3)$$

40

30

10

# R<sub>10</sub>:基準温度におけるヒータの抵抗値

【0018】

式(3)から、以下の式(4)に示すように、安定時のヒータ温度(目標温度)を算出す 50

ることができる。 【数4】

# $T_h = \frac{1}{TCR} \cdot \frac{R_h - R_0}{R_0} + T_0 \quad (4)$

【0019】

しかしながら、上記の式(2)で示したように、図6のヒータ温度制御回路では、目標抵抗値Rhに、誤差が生じる。最悪のケースとしては、抵抗値R1、R3が大きくなる方に 誤差が生じ、抵抗値R2が小さくなる方に誤差が生じたときは、目標抵抗値Rhの誤差が 非常に大きくなる。

【0020】

したがって、ヒータ100の温度精度を高めることができず、ヒータ100を用いたセン サ装置のセンサ感度が低下したり、ばらつきが大きくなりやすい。

【0021】

そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、従来に比べて、ヒータ温度を高 精度に制御することができるヒータ温度制御回路、及び、それを用いたセンサ装置を提供 することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0022】

本発明は、ヒータの温度を制御するヒータ温度制御回路であって、前記ヒータ温度制御回 路は、第1回路と第2回路とが並列に接続されたブリッジ回路と、前記ブリッジ回路に接 続されるオペアンプと、を含み、前記第1回路は、前記ヒータと抵抗器とが直列に接続さ れ、前記第1回路の中点が、前記オペアンプの一方の入力部に接続されており、

前記第2回路からは、前記ブリッジ回路のリファレンス電圧Vrefに、前記ヒータの目 標抵抗値Rhと前記抵抗器の抵抗値R1との分圧比を乗じた出力値Voutが、前記オペ アンプの他方の入力部に入力され、前記第2回路は、D/Aコンバータ、或いは、マルチ プレクサを含み、前記D/Aコンバータ、或いは、マルチプレクサの出力部が、前記オペ アンプの他方の入力部に接続されていることを特徴とする。

【0024】

また、本発明では、前記第2回路は、前記D/Aコンバータを含み、前記D/Aコンバー タには、前記分圧比に2n-1(nは、前記D/Aコンバータのビット数)を乗じたデジ タルデータが入力されることが好ましい。

[0026]

また、本発明では、前記オペアンプの出力部側に、ローパスフィルタが接続されていることが好ましい。

【0027】

また、本発明では、前記ブリッジ回路の入力部と、前記ローパスフィルタの出力部との間 に、電流増幅用トランジスタが接続されていることが好ましい。

【0028】

また、本発明におけるセンサ装置は、センサ素子と、上記のいずれかに記載のヒータ温度 制御回路と、を有することを特徴とする。

【0029】

また、本発明では、前記センサ素子は、ガス濃度を検出することが好ましい。

【発明の効果】

【 0 0 3 0 】

本発明のヒータ温度制御装置によれば、従来に比べて、ヒータの温度精度を向上させるこ とができる。また、本発明では、ヒータの設定温度を柔軟に、調整し、また変更できる等 、従来のヒータ温度制御装置では実現できない効果を備える。

【図面の簡単な説明】

30

10

[0031]【図1】本実施形態のセンサ装置の一例を示す斜視図である。 【図2】本実施形態のヒータ温度制御回路の最小単位を示す回路図である。 【図3】図2と一部異なる本実施形態のヒータ温度制御回路の最小単位を示す回路図であ る。 【図4】図2に示すヒータ温度制御回路の応用例を示す回路図である。 【図5】図2に示すヒータ温度制御回路の応用例を示す回路図である。 【図6】従来のヒータ温度制御回路の最小単位を示す回路図である。 【発明を実施するための形態】 [0032]以下、本発明の一実施形態(以下、「実施形態」と略記する。)について、詳細に説明す る。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種 々変形して実施することができる。 [0033]図1は、本実施形態のセンサ装置の一例を示す斜視図である。図1は、接触燃焼式ガスセ ンサの一例であり、例えば、水素濃度を検出可能な水素センサである。 [0034]図1に示す符号1は、水晶の結晶をエッチングなどで切り出して作製された水晶板(水晶 基板)である。符号2は、検出用水晶振動子であり、符号3は、参照用水晶振動子である。 [0035]図1に示すように、検出用水晶振動子2には、水晶板1を切り出して形成された水晶面に 、水素反応触媒層4が形成されている。水素反応触媒層4は、例えば、白金膜により形成 されている。 [0036] 図1に示すように、参照用水晶振動子3には、水晶板1を切り出して形成された水晶面に 、水素非反応層5が形成されている。水素非反応層5は、例えば、金薄膜で形成されてい ລຸ [0037]なお、図示しないが、水素反応触媒層4、及び、水素非反応層5は、各水晶振動子2、3 の両面に形成される。 [0038]ところで、水素反応触媒層4としての白金膜が、触媒作用を発揮するためには、所定温度 以上に加熱することが必要である。このため、図1に示すように、加熱用の線状のヒータ 6が、水素反応触媒層4に隣接して形成されている。 [0039]また、図1に示すように、加熱用の線状のヒータ6は、水素非反応層5にも近接して形成 されている。 [0040]図1では、ヒータ6は、水素反応触媒層4、及び、水素非反応層5の周囲を囲むように形 成されるが、これは一例であって、ヒータ6の形状や配置等を限定するものではない。 [0041]なお、水素反応触媒層4、及び、水素非反応層5の加熱用としてのヒータ6は、互いに同 じ特性を有するように、例えば、同じ材質で形成されることが好ましい。これは、水素反 応触媒層4と水素非反応層5の両方を同一条件で加熱し、水素反応触媒層4の発生する熱 量を正確に検出するためである。 [0042]

図1に示す端子9は、検出用水晶振動子2の共振周波数を測定するためにコルピッツ発振 回路などの発振回路(図示せず)に接続される。また、その発振回路は周波数測定装置( 図示せず)に接続される。

【0043】

20

10

30

40

図1に示す水素センサの動作原理について説明する。まず、ヒータ6の端子7,8に給電 し、ヒータ6を加熱する。このとき、ヒータ6が所定温度となるように制御される。温度 制御は、後述するヒータ温度制御回路で行われる。この給電によって、検出用水晶振動子 2と、参照用水晶振動子3は、同一条件で予熱された状態となる。ここで予熱とは、水素 反応触媒層4が触媒として機能する温度まで温度を上げることである。

【0044】

また、端子9をそれぞれ発振回路に接続する。水晶板2,3は厚み滑り振動子として振動し、その固有振動数に応じた周波数信号が発振回路から出力する。発振回路の発振周波数は、周波数測定装置で測定され、検出用水晶振動子2の共振周波数が測定される。

[0045]

ここで、予熱によって温度が上昇した状態の検出用水晶振動子 2、及び、参照用水晶振動 子 3の共振周波数を測定する。

【0046】

この状態で、水素を含む空気が流れて来ると、この水素センサの水素反応触媒層4における触媒の作用で、水素が空気中の酸素によって酸化される。この酸化に伴い、酸化熱が発生し、検出用水晶振動子2の温度が予熱温度以上に上昇する。

【0047】

参照用水晶振動子3には水素非反応層5が形成されており、空気中に水素が含まれていて も水素の酸化は行われず、参照用水晶振動子3の温度は、予熱温度のまま維持される。す なわち、検出用水晶振動子2は、水素の酸化熱によって予熱以上の温度になり、一方、参 照用水晶振動子3は、予熱温度のままとなる。よって、検出用水晶振動子2の共振周波数 は、予熱温度と水素の酸化熱による温度上昇に伴う温度での共振周波数となり、一方、参 照用水晶振動子3の共振周波数は、予熱温度での共振周波数となる。

【0048】

ここで、検出用水晶振動子2の共振周波数と参照用水晶振動子3の共振周波数とを測定し、その差を取ると、予熱によって上昇した温度の要素がなくなり、検出用水晶振動子2が 純粋に水素の酸化熱によって受けた影響に伴う周波数変化の要素のみを検出することが可 能になる。

【0049】

このようにして、水素の酸化熱による周波数変化を測定することにより、空気中の水素濃 度を測定することができる。

上記した水素センサ等の接触燃焼式ガスセンサは、ヒータ6により100 ~350 程度の温度に加熱することで触媒が活性化し、被測定ガスを検出することができる。

【0051】

センサ感度は、触媒温度により変化するため、ガス濃度の検出精度を高めるには、ヒータ 温度を目標温度に維持することが可能なヒータ温度制御回路が必要となる。

【0052】

そこで本発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、ブリッジ回路に使用する抵抗器の数を削減 することで、ヒータの目標温度に対する誤差を低減でき、従来に比べて、高精度なヒータ 温度制御回路を開発するに至った。以下、本実施形態のヒータ温度制御回路について詳述 する。

【 0 0 5 3 】

図2は、本実施形態のヒータ温度制御回路の最小単位を示す回路図である。図2に示すように、本実施形態のヒータ温度制御回路10は、ブリッジ回路11と、ブリッジ回路11 に接続される駆動用のオペアンプ12とを、有して構成される。

【0054】

図 2 に示すように、ブリッジ回路 1 1 は、入力部 1 1 a と、接地部 1 1 b との間に、第 1 回路 1 1 c と第 2 回路 1 1 d とが並列に接続されている。

【0055】

20

図 2 に示すように、第1回路11 c には、抵抗器13と、ヒータ6とが直列に接続されて いる。抵抗器13は、例えば、固定抵抗器である。図1に示すように、第1回路11 c の 中点(出力部)11 e が、オペアンプ12の反転入力端子(Vin・端子)12 a に接続 されている。

(7)

【 0 0 5 6 】

図 2 に示すように、第 2 回路 1 1 d には、 D / A コンバータ(デジタル / アナログコンバ ータ) 1 5 が接続されている。そして、 D / A コンバータ 1 5 の出力部 1 5 a が、オペア ンプ 1 2 の非反転入力端子( V i n + 端子) 1 2 b に接続されている。なお、ここで使用 する D / A コンバータは、リファレンス電圧の外部入力端子 V r e f を有するものである。 【 0 0 5 7 】

本実施形態では、図6に示す従来のヒータ温度制御回路(最小単位)と比較して明らかな ように、ブリッジ回路11から抵抗器102、103(図6参照)を削除し、その代わり に、D/Aコンバータ15を第2回路11dに接続している。このように、本実施形態で は、ブリッジ回路に使用する抵抗器の数は一つのみであり、抵抗器数を最小にすることが 可能である。

[0058]

図 2 に示す本実施形態のヒータ温度制御回路の平衡条件は、以下の式(5)で示される。 【0059】

【数5】

$$\frac{v_{out}}{v_{ref}} = \frac{R_h}{R_1 + R_h} \qquad (5)$$

【0060】

ここで、 V<sub>out</sub>は、 D / A コンバータ15の出力値である。 V<sub>ref</sub>は、入力部11a に印加されるリファレンス電圧である。 R<sub>h</sub>は、ヒータ6の目標抵抗値である。 R<sub>1</sub>は、 抵抗器13の抵抗値である。

【0061】

図2に示すヒータ温度制御回路10の動作原理について説明する。オペアンプ12へは、 D/Aコンバータ15からの電圧出力(出力値Vout)が入力される。一方、第1回路 11cの中点11eからは、抵抗値R1とヒータ6の抵抗値との分圧比に基づく出力が入 力される。したがって、オペアンプ12から差動出力が得られ、その差動出力に応じて、 ヒータ6へ流れる電流量が変動する。なお、電流は、ほとんど第1回路11c側に流れる 。ヒータ6に電流が流れることで、ヒータ温度が上昇し、それに伴い、ヒータ6の抵抗値 も上昇する。いずれヒータ6が目標温度に到達したら、目標抵抗値Rhとなり、オペアン プ12の出力電圧の上昇は停止する。外気温の変動や風などの外乱により、ヒータの温度 が変動した場合は、それに応じてオペアンプの出力電圧が変化し、ヒータの放熱とバラン スする電圧値で安定する。

【0062】

上記の式(5)を変形し、ヒータ6の目標抵抗値Rhの式に直すと以下の式(6)のよう 4 になる。

【0063】

【数6】

$$R_h = \frac{v_{out}}{v_{ref} - v_{out}} R_1 \quad (6)$$

【0064】

ここで、ブリッジ回路11に設けられた抵抗器13の抵抗値許容誤差及び抵抗温度係数( TCR)を加味すると、上記の式(6)は、以下の式(7)のように変形することができ 10

30

*E*:抵抗值許容誤差

 $E_r$ :抵抗温度係数(TCR)による誤差

 $E_t = TCR \times \Delta T_r$  (外気温変化)

[0066]さて、本実施形態では、D/Aコンバータ15のデジタルデータ入力端子15bから、以 下の式(8)に示すデジタルデータ(DATA)が入力される。 [0067] $DATA = \{R_{h} / (R_{1} + R_{h})\} \times (2^{n} - 1) \quad (8)$ nは、D/Aコンバータのビット数である。 [0068]上記の式(8)に示す2n-1は、デジタルデータのフルスケールである。したがって、 このフルスケールに、分圧比 { R h / ( R 1 + R h ) }を乗算することで、フルスケール データを分圧比に応じたデジタルデータに変換することができる。なお、ビット数nを限 定するものではないが、8ビット~24ビットのものであれば、安価に入手可能である。 [0069]デジタルデータは、汎用マイコンなどを用いることで、外部から書き込むことが可能であ る。したがって、デジタルデータを任意に設定及び変更することが可能である。通信方式 としては、I2CやSPIなどのシリアルデータを取り扱うシリアル方式や、パラレルデ ータを取り扱うパラレル方式があり、特に、通信方式を限定するものではない。 目標抵抗値Rh及び固定抵抗R1は、例えば、メーカのカタログ値から得ることができる 。これら抵抗値を適宜設定し、デジタルデータを書き込む。図2に示すように、D/Aコ ンバータ15には、リファレンス電圧Vrefが入力されており、したがって、上記の式 (5)より、出力値Voutを得ることができ、オペアンプ12に入力される。 [0071]ここで、本実施形態の目標抵抗値Rhについて考察すると、ブリッジ回路11の平衡条件 から得られる目標抵抗値Rhは、上記の式(7)であるが、式(7)から明らかなように 、本実施形態では、従来回路における抵抗器102、103の誤差の影響を無くすことが できる。 [0072] また、D/Aコンバータ15の確度は、ビット数と誤差の仕様値で考えることができる。 例えば、16ビットで、±数LSBの誤差を有するD/Aコンバータ15であれば、数十 ppm(10<sup>-5</sup>)の確度を得ることができる。 [0073] このため、本実施形態のように、抵抗器102、103(図6参照)に代えて、D/Aコ ンバータ15を用いることで、式(7)にて得られる目標抵抗値Rhの誤差を小さくする ことができる。 [0074]

40

50

10

したがって、本実施形態では、従来に比べて、ヒータ6の温度精度を向上させることがで きる。なお、ヒータ温度の計算式は、上述の式(4)と同じであるため、割愛する。 【0075】 次に、ヒータの温度誤差について白金ヒータを具体例として説明する。まず、図6に示す 従来のヒータ温度制御回路での誤差を求めた。ヒータの目標抵抗値Rh=50、TCR =+3900ppm/ (純白金)に対して、抵抗器101、102、103に汎用抵抗 器を用いた場合、許容誤差±5%、TCR=±100ppm/ として計算した。その結

果、許容誤差によるヒータの抵抗偏差は最大8 であり、温度換算すると41 であった。すなわち、従来のヒータ温度制御回路では、最大で41 もの温度誤差が生じる結果になった。なお、以下の表1に、計算に使用した抵抗器の物性を示す。 【0076】

【表1】

名称	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R 3	R <sub>h</sub>
		汎用抵抗器		白金ヒータ
抵抗値[Ω]	10	10 k	5 0 k	50
許容誤差[%]	± 5	± 5	± 5	
TCR [ppm/°C]	±100	±100	±100	+3900

【0077】

なお、表1に示す抵抗器の物性値は、一般に市販されている汎用品のカタログ値である。 【0078】

また、20 ±60 の温度変化を加えて試算すると、許容誤差と抵抗温度係数TCRの 二つの誤差によるヒータの抵抗偏差は最大で9 であり、温度換算すると47 の誤差が 生じた。なお、計算結果からわかるように、温度誤差においては、抵抗値許容誤差の影響 が支配的であることがわかる。

【 0 0 7 9 】

また、別の例として、高精度の抵抗器(許容誤差:±0.1%、TCR=±25ppm/ )を使用した場合、許容誤差によるヒータの抵抗偏差は最大で0.4 であり、温度換 算すると1.9 の誤差が生じた。高精度の抵抗器を用いれば、幾分、ヒータの温度精度 を改善できているが、まだ不十分である。なお、以下の表2に、計算に使用した高精度の 抵抗器の物性を示す。

- [0080]
- 【表2】

名称	R <sub>1</sub>	R 2	R <sub>3</sub>	R <sub>b</sub>			
種類		高精度抵抗器					
抵抗値[Ω]	1 0	1 0 k	5 0 k	50			
許容誤差[%]	$\pm 0.1$	$\pm 0.1$	±0.1				
TCR [ppm/°C]	$\pm 25$	$\pm 25$	±25	+3900			

【0081】

なお、表2に示す抵抗器の物性値は、市販品の中で精度の高い製品のカタログ値である。 【0082】

また、温度調節用として抵抗器(R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>の何れか、または複数)に、可変抵抗器(ボリューム)を使用すると、逆に、抵抗値精度が悪化し、温度誤差も大きくなること

20

がわかった。更に、マイクロヒータの材料としてよく用いられる薄膜金属ヒータ等の抵抗 温度係数TCRが白金バルク値よりも小さなヒータの場合、白金バルク値との抵抗温度係 数の比に比例して、倍々に温度偏差が大きくなることがわかった。

【 0 0 8 3 】

これに対して、本実施形態では、例えば、16ビットのD/Aコンバータ15で、Dif ferential Nonlinearity(微分非直線性)が、±1LSBの素子 を回路に組み込んだ場合、精度としては、約30ppm(0.03%)程度の誤差しか生 じず、従来のヒータ温度制御回路のように抵抗器102、103(図6参照)を使用した 場合よりも、一桁以上の精度改善が可能であるとわかった。これにより、本実施形態の許 容誤差によるヒータの抵抗偏差は最大で0.16 であり、温度換算すると0.8 であ り、このように、温度の誤差を±1 以下に低減できるとわかった。 【0084】

図3の実施形態では、図2に対して、ヒータ6と抵抗器13の位置を入れ替えている。な お、図3に示すように、オペアンプ12の反転入力端子12aと非反転入力端子12bが 図2とは逆になる。また、図3におけるヒータ温度制御回路での平衡条件は、以下の式( 9)により求めることができる。

### 【0085】 【数8】

 $\frac{V_{out}}{V_{ref}} = \frac{R_1}{R_1 + R_h}$ (9)

【0086】

図3のように、ヒータ6と抵抗器13の位置を入れ替えても、図2と同様に動作可能であ り、ヒータ温度を高精度に維持することができる。

【 0 0 8 7 】

ところで、 D / A コンバータを用いたヒータ温度制御回路では、 D / A コンバータ15からの出力の初期状態によっては、正帰還による問題が生じる。即ち、 D / A コンバータ15の出力の初期値が0 V である場合、デジタルデータ(D A T A)が書き込まれるまでの間に、オペアンプ12の出力が低下する方向へ動作し、オペアンプ12からの出力が0 V になった時点で回路全体が動かなくなるという問題が生じる。

【0088】

このため、オペアンプ12の出力が0Vにならないように、例えば、オペアンプ12の入 力段に工夫を施すことが必要とされる。具体的には、オペアンプ12の非反転入力端子( Vin+端子)に、一時的に正電圧を印加したり、オペアンプ12の反転入力端子(Vi n-端子)に、一時的に負電圧を印加したり、或いは、D/Aコンバータ15のVref 端子に、一時的に正電圧を印加し、オペアンプ12の出力が0Vにならないように調節す る。上記に挙げた構成は一例であって、これらに限定されるものではない。

【 0 0 8 9 】

また、図2や図3に示した最小構成のヒータ温度制御回路10では、制御系にヒータ6の 時定数という遅れ要素が入っている。このため、出力信号の位相が180。回ると、オペ アンプ12が異常発振するという問題が生じる。例えば、負帰還制御系で位相が180。 回る周波数で、ループゲインが1より大きい場合に、フィードバック制御系ヒータの時定 数に応じた周波数での発振条件が成立し、異常発振が生じる。

【 0 0 9 0 】

そこで、本実施形態では、図4に示す応用例に示すように、オペアンプ12の出力段に、 異常発振防止用のローパスフィルタ(LPF)20を接続した。また、図4では、オペア ンプ12に帰還抵抗21を付与した。これにより、ヒータ温度制御回路10の応答周波数 10

を、ヒータ6の時定数よりも遅くすることでループゲインを1以下に小さくすることができる。これにより、異常発振を抑制することができる。

【0091】

なお、ヒータ温度制御回路10の応答速度が遅くなると、ヒータ6が目標温度に達するま での加熱時間が遅くなったり、外気温の変動に対する追従性が悪化しやすい。そこで、高 次フィルタや、アクティブフィルタなど減衰率の大きいローパスフィルタ(LPF)20 を使用することで、ループゲインが1以下となる条件を満足する範囲を広げることができ 、ヒータ温度制御回路10の応答速度を最大化することができる。

【0092】

ただし、応答性を重視しない場合は、ローパスフィルタ20に、一次フィルタを使用する ことで、最小の素子数で回路を実現できる。図5は、図4の回路構成から、更に、電流増 幅用のトランジスタを追加した応用例である。図5に示すように、電流増幅用のトランジ スタ22を、ブリッジ回路の入力部11aとローパスフィルタ20の出力部20aとの間 に接続する。これにより、ブリッジ回路11の第1回路11cへの電流を増幅でき、すな わち、ヒータ6に流す電流量を大きくでき、消費電力の大きなヒータでも駆動することが できる。

[0093]

本実施形態のヒータ温度制御回路10では、ブリッジ回路11の第2回路11dからオペ アンプ12への出力値Voutは、ブリッジ回路11のリファレンス電圧Vrefに、ヒ ータの目標抵抗値Rhと抵抗値R1との分圧比を乗じた値、すなわち、Vref×{Rh /(Rh+R1)}、或いは、Vref×{R1/(Rh+R1)}として制御される。 【0094】

20

30

10

上記した出力値 Voutは、D/Aコンバータ15以外にマルチプレクサを用いてアナロ グ的に処理してもよい。

【0095】

本実施形態におけるヒータ温度制御回路10を用いたことの効果について説明する。まず 、第一に、ヒータ6の温度精度を従来よりも高めることができる。第二に、ヒータ6の温 度設定を柔軟に調整及び、変更することができる。すなわち、D/Aコンバータ15を用 いたヒータ温度制御回路10では、固定抵抗器或いは半固定抵抗器によるブリッジ回路で は実現できない、ヒータ加熱中での設定温度変更を自由にすることができる。

【 0 0 9 6 】

例えば、センサ装置の運転中に、ヒータ6の温度を切り替えて複数のガスを検出したり、 ヒータ6を常温から徐々に加熱することで、センサ素子への熱応力を緩和することができ る。また、一時的に本来の設定温度よりも高温に設定し、ヒータ温度の立ち上がり速度が 高速となるように調節することも出来る。

【 0 0 9 7 】

ただし、ヒータ6と抵抗器13による電圧降下、すなわちリファレンス電圧Vrefがオペアンプ12の最大出力電圧を越えない範囲に制限される。

【0098】

なお、従来のブリッジ回路によるヒータ温度制御回路においても、ボリュームによって抵 抗値を合わせ込み、抵抗値精度を一時的に高めることは可能であるが、振動やバックラッ シュによる抵抗値のドリフトを避けることはできない。また、抵抗温度係数(TCR)が 高精度抵抗器(表2参照)と比べて大きい。このため、このような構成のものに比べても 、本実施形態のヒータ温度制御回路10は、より効果的に、ヒータの温度精度を高めるこ とができる。

【0099】

また、従来においては、ヒータに流れる電流をシャント抵抗(電流検出用抵抗)で検出し 、印加電圧をダイナミックに制御する方法も使用されるが、1W以下のマイクロヒータに おいては、シャント抵抗の抵抗値による誤差の影響が大きい。したがって、このような構 成のものに比べても、本実施形態のヒータ温度制御回路は、より効果的に、ヒータの温度

精度を高めることができる。

【0100】

また、シャント抵抗を使用した制御回路において電圧制御用に使用する制御マイコンは、 PID制御などのリアルタイムでの処理が必要となるため、CPUを占有する。これに対 して、本実施形態では、起動時に、D/Aコンバータ15へのデジタルデータの書き込み 、あるいはマルチプレクサへの分圧比制御を一度行えば、後は回路が独立して制御するた め、マイコンの負担が極めて軽微である。

【0101】

なお、本実施形態のヒータ温度制御回路は、図1に示す水素センサ等の接触燃焼式ガスセ ンサのみならず、酸化物半導体式ガスセンサ、或いは、流量センサ等の熱式センサなどマ イクロヒータを搭載した各種センサ・デバイスの温度制御用に適用可能である。

【産業上の利用可能性】

【0102】

本発明のヒータ温度制御回路によれば、ヒータ温度精度を向上させることができるため、 接触燃焼式ガスセンサや、酸化物半導体式ガスセンサ、またガスセンサに限らず、ヒータ を有するMEMSセンサ等、センサ精度が求められる様々なデバイスに適用することがで きる。

【符号の説明】

【0103】

#### 1 :水晶板

- 2 : 検出用水晶振動子
- 3 :参照用水晶振動子
- 4 :水素反応触媒層
- 5 : 水素非反応層
- 6 : ヒータ
- 10 : ヒータ温度制御回路
- 11 : ブリッジ回路
- 11a :入力部
- 11b : 接地部
- 11c : 第1回路
- 1 1 d :第 2 回路
- 11e :中点
- 12 :オペアンプ
- 12a :反転入力端子
- 12b : 非反転入力端子
- 13 :抵抗器
- 15 : D / A コンバータ
- 15a :出力部
- 15b :デジタルデータ入力端子
- 20 : ローパスフィルタ
- 20a :出力部
- 21 :帰還抵抗
- 22 : トランジスタ
- R<sub>1</sub> :抵抗值
- Rh :目標抵抗値
- Vout :出力値
- Vref :外部リファレンス電圧

50

40

20

【図面】 【図1】

【図2】

(13)





【図3】



【図4】



20

30





10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者	大橋	光男																
	長野り	県伊那市	市荒	井	3	6	7	2	番	地	K	0	A	株	<b></b> 走	; <del></del>	≹社	内
(72)発明者	下島	瑞穂																
	長野り	県伊那⋷	市荒	井	3	6	7	2	番	地	K	0	A	株	<b></b> 走	; <u></u>	≹社	内
(72)発明者	矢野	孝明																
	長野り	県伊那市	<b></b>	井	3	6	7	2	番	地	K	0	A	株	<b></b> 走	; <del></del>	≹社	内
審査官	土屋	正志																
(56)参考文献		特開	20	1	2	-	2	5	1	9	7	5	(	J	Ρ	,	A )	)
		特開	2 0	1	5	-	1	2	5	0	3	3	(	J	Ρ	,	A )	)
		特開	20	0	7	-	2	4	5	4	8	9	(	J	Ρ	,	A )	)
		特開	20	1	7	-	0	5	4	3	4	0	(	J	Ρ	,	A )	)
		特開	20	1	3	-	0	8	8	9	1	8	(	J	Ρ	,	A )	)
(58)調査した?	分野	(Int.Cl.	, C	) E	3名	3)												
		G 0	5 D		2	3	/	1	9									

H 0 5 B 3 / 0 0